# 08,16

# Эффекты резистивного переключения в пленках на основе нанокристаллов неорганических перовскитов CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>), сопряженного полимера P3HT и [60]PCBM

© М.К. Овезов, А.Н. Алешин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: strontiumx94@gmail.com, aleshin@transport.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 20 февраля 2024 г.

В окончательной редакцию 20 февраля 2024 г. Принята к публикации 1 марта 2024 г.

Разработка надежных оптико-электронных мемристоров имеет решающее значение для успешного развития нейроморфных систем, однако существующие устройства страдают от неконтролируемой динамики миграции ионов, приводящей к непредсказуемым параметрам резистивного переключения. В настоящей работе были получены структуры с использованием нанокристаллов неорганических перовскитов — квантовых точек CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>), пленок сопряженного полимера поли(3-гексилтиофена) (P3HT) и производного фуллерена [60]PCBM. Были исследованы морфология и оптоэлектронные свойства полученных сандвичструктур. Установлено, что при 300 К полученные образцы демонстрируют эффект памяти, заключающийся в переключении из высоко- в низкорезистивное состояние при подаче напряжения. Обсуждается природа наблюдаемого в таких структурах эффекта памяти, связанного с захватом носителей заряда ловушками, а также перспективы использования подобных материалов в нейроморфных интерфейсах и для изготовления ячеек памяти — мемристоров.

Ключевые слова: неорганические перовскиты, механизмы транспорта, резистивное переключение, мемристоры, проводящие полимеры.

DOI: 10.61011/FTT.2024.04.57798.31

#### 1. Введение

Развитие цифровых технологий ставит перед связанной с ними электронно-компонентной базой новые актуальные задачи. Стремительно эволюционирующие виртуальные экосистемы, связанные с интернетом, в частности, с интернетом вещей, требуют роста быстродействия приборов и устройств, в которые они интегрированы. Общепринятая на данный момент архитектура фон Неймана долгое время позволяла удовлетворить все возрастающий спрос на характеристики аппаратной базы, но развитие технологий выявляет накладываемые на нее ограничения [1-3]. Одним из главных подобных ограничений является разница в быстродействии между процессором и памятью компьютера, создающая дисбаланс при обмене данными между ними, что, в свою очередь, ограничивает скорость работы компьютера. Разработка надежных оптико-электронных мемристоров имеет решающее значение для успешного решения этой задачи с целью развития нейроморфных систем. В последние годы с целью улучшения характеристик мемристоров был значительно расширен диапазон материалов, используемых для их создания [4,5]. Были разработаны мемристоры на основе перовскитов [6], оксидов кремния (в основном SiO<sub>2</sub>) [7], оксидов металлов [8], графена и его производных [9] и т.д. Большая часть таких материалов улучшает стабильность характеристик мемристоров, однако они содержат кислородные вакансии, ограничивающие мемристорный эффект. Важным направлением исследований является использование в качестве мемристоров материалов не содержащих оксидов, таких как неорганические нанокристаллы перовскитов. Эффекты переключения в таких системах и влияние на них слоев полупроводниковых полимеров и производных фуллеренов в настоящее время изучены недостаточно.

В настоящей работе были получены сандвичструктуры с использованием нанокристаллов (HK) неорганических перовскитов — квантовых точек — CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>), сопряженного полупроводникового полимера поли(3-гексилтиофена) (P3HT) и производного фуллерена [60]PCBM. Были исследованы морфология и оптоэлектронные свойства полученных структур. Установлено, что при 300 К полученные образцы демонстрируют эффект памяти, заключающийся в переключении структуры из высоко- в низкорезистивное состояние при подаче напряжения. Обсуждается природа наблюдаемого в таких структурах эффекта памяти, связанного с захватом носителей заряда ловушками, а также перспективы использования подобных материалов в нейроморфных интерфейсах.

## 2. Объекты и методы исследования

Исследуемые структуры были изготовлены путем нанесения соответствующих растворов на стеклянные

подложки с проводящими слоями оксида индия допированного оловом (ITO) шириной 5 mm. На слой ITO для согласования работ выхода дырочных слоев наносили слой проводящего полимера — поли(3,4-этилендиокситиофен) полистирол-сульфоната (PEDOT: PSS) (Sigma Aldrich) и затем высушивали при 60°С в течение 30 min. Пленки PEDOT: PSS наносились методом центрифугирования с использованием центрифуги Chemat Technology spin-coater KW-4А при скоростях 1000 rpm и 3500 rpm в течение 10 и 30 s соответственно. Слои НК CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>) (детали синтеза НК были описаны ранее в [10]) наносились на PEDOT: PSS и высушивались в течение 10 min при температуре 100°С. Для более эффективного поглощения света структурой на слой НК наносили слои полупроводникового полимера РЗНТ и производного фуллерена [60]РСВМ (оба — Sigma Aldrich), которые сушили в течение 10 min при температуре 60°С в инертном боксе в атмосфере азота. Полученные образцы перед измерениями хранились в вакуумном эксикаторе MB "SANPLATEC Corp.". Строение молекул материалов, использованных в данной работе, а также структура исследованных в работе образцов представлены на рис. 1 и 2 соответственно. Морфология поверхности нанесенных слоев НК исследовалась с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) при помощи SOLVER P47 PRO NT-MDT. Фотолюминесценция (ФЛ) пленок НК CsPbI<sub>3</sub> и CsPbBr<sub>3</sub> возбуждалась ультрафиолетовым светодиодом LED UVTOP280TO39HS с длиной волны 285 nm.

Вольтамперные характеристики (ВАХ) образцов измерялись в планарной геометрии по двухзондовой схеме при комнатной температуре в темноте и при освещении имитатором солнечного света с использованием автоматизированной измерительной установки на базе пикоамперметра Keithley 6487. Приложенное напряжение изменялось от -2 до 2 V с переменным шагом. Контакты к электродам ITO (PEDOT:PSS) крепили серебряной проволокой с использованием угольной пасты. Контакты к P3HT реализовали в виде прижимных медных электродов.

# 3. Результаты и обсуждение

Результаты АСМ-исследований морфологии пленок НК CsPbBr<sub>3</sub>, нанесенных на *c*-Si подложку, представленные на рис. 3, указывают на наличие у образцов развитой поверхности с относительно неоднородной морфологией. Как видно из рис. 3, в исследованных пленках наблюдаются глобулы, состоящие из массивов НК CsPbBr<sub>3</sub>, с ярко выраженными границами, при этом средний диаметр зерен варьируется в пределах ~ 500-700 nm, а их высота составляет ~ 60-80 nm. Исследуемые пленки НК CsPbBr<sub>3</sub> характеризуются значительной шероховатостью (Root Mean Square, *Rq*), которая в поле  $2 \times 2 \mu m$  составила *Rq* ~ 33.6 nm (Average Roughness = 26.7 nm) (рис. 3, *b*, *c*).

Спектры поглощения и ФЛ пленок НК CsPbBr<sub>3</sub> и НК CsPbI<sub>3</sub>, а также пленок РЗНТ и [60] РСВМ показаны



**Рис. 1.** Структурная формула *a*) CsPbX<sub>3</sub>, где X — I, Br, *b*) P3HT, *c*) [60] PCBM, *g*) PEDOT: PSS.



Рис. 2. Структура исследованных структур.

на рис. 4, *а* и *b* соответственно. Как видно из рис. 4, *a*, край поглощения и максимум ФЛ пленок HK CsPbBr<sub>3</sub> и HK CsPbI<sub>3</sub> соответствуют длине волны 510 nm и 680 nm, соответственно, а край поглощения пленки P3HT — 640 nm. Таким образом, HK CsPbBr<sub>3</sub> поглощают свет в диапазоне около 500 nm, в то время как край поглощения HK CsPbI<sub>3</sub> смещен в красную область спектра (680–690 nm). Использование пленок P3HT и [60]PCBM также позволяет сместить край поглощения всей структуры в более длинноволновую область и расширить спектральный диапазон поглощения. Аналогичный эффект в отношении пленок металлорганических перовскитов широко используется при изготовлении солнечных элементов.

На рис. 5, *а*, *b* представлены ВАХ структуры на основе НК CsPbBr<sub>3</sub> и пленки P3HT: ITO/PEDOT:PSS/ CsPbBr<sub>3</sub>/P3HT/Cu. Структура демонстрирует ярко выраженные диодные свойства с отношением токов при прямом и обратном смещении, достигающим четырех



**Рис. 3.** Результаты АСМ-исследований морфологии пленок НК CsPbBr<sub>3</sub>, нанесенных на *c*-Si.

порядков, а также эффект резистивного переключения, наблюдающийся при подаче прямого смещения  $\sim 0.2-0.3$  V. Наблюдается наличие обратного переключения при уменьшении напряжения, при этом эффект переключения более ярко выражен при последующих проходах, как показано на рис. 5, *b*, а ВАХ до и после переключения носит омический характер, что согласуется с результатами предыдущих исследований [11]. Наблюдаемый характер ВАХ, во многом аналогичен ВАХ пленок

металлоорганических перовскитов [11,12], что с учетом их воспроизводимости, делает исследуемые структуры перспективными с точки зрения их использования в мемристорных и RRAM — приборных структурах.

Типичная ВАХ композитной пленки ITO/PEDOT: PSS/ CsPbI<sub>3</sub>/P3HT/[60]PCBM/Cu представлена на рис. 6, *a*, *b*. Эффект переключения из низкопроводящего в высокопроводящее состояние в этих образцах происходит при подаче на электроды смещения порядка 0.9-1 V при освещении имитатором солнечного света. Стоит отметить, что как до, так и после переключения, BAX подчиняются омическому закону, при этом отношение тока в высоко- и низкопроводящих состояниях отличалось в 150–200 раз. Образцы оставались в фотоиндуцированном переключенном состоянии до тех пор, пока на них действовало смещение, при подаче обратного смещения переключение не наблюдалось, при этом образцы демонстрировали диодные свойства с отношением токов при прямом и обратном смещении, равным 10.

На рис. 7, *a*, *b* представлены диаграммы энергетических уровней сандвич-структур ITO/PEDOT: PSS/ CsPbBr<sub>3</sub>/P3HT/Cu (*a*) и ITO/PEDOT: PSS/CsPbI<sub>3</sub>/P3HT/ [60]PCBM/Cu (*b*). Рассматриваемые структуры поглоща-



**Рис. 4.** *а*) Спектры поглощения чистых пленок НК CsPbBr<sub>3</sub> (линия 1), и НК CsPbI<sub>3</sub> (линия 2) на кварцевых подложках; спектры ФЛ чистых НК CsPbBr<sub>3</sub> (линия 3) и НК CsPbI<sub>3</sub> (линия 4); *b*) Спектры поглощения (1, 2) и ФЛ (3) пленок: РЗНТ (1, 3) и [60]РСВМ (2) соответственно.



**Рис. 5.** ВАХ структуры ITO/PEDOT: PSS/CsPbBr<sub>3</sub>/P3HT/Cu, измеренные в темноте, в прямом и полулогарифмическом масштабе, при первом (*a*) и втором (*b*) проходе.

ют фотоны, а затем после диссоциации экситонов на границах раздела  $P3HT/CsPbBr_3(I_3)$  генерируются свободные носители. Следовательно, встроенное электрическое поле на интерфейсах, индуцированное накопленными электронами, приводит к хорошей фоточувствительности образцов при облучении имитатором солнечного света.

Таким образом, эффект резистивного переключения наблюдается не только в структурах на основе пленок металлорганических перовскитов [11,12], но и в сандвичструктурах на основе НК неорганических перовскитов — CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>) и полупроводникового полимера P3HT — как в темноте, так и при освещении.

Феномен памяти в подобных материалах можно объяснить захватом и последующим освобождением заряда ловушками. Возможности оптического программирования позволяют мемристорам в обоих исследованиях моделировать синаптическую пластичность при световой стимуляции, что обеспечивает экономически эффективное направление для создания искусственных синаптических устройств с фотоэлектрическими операциями в области проектирования архитектуры памяти с использованием НК. В последнее время большое внимание привлекают реконфигурируемые устройства, которые могут переключаться между энергозависимыми и энергонезависимыми состояниями [12,13]. В 2022 г. были продемонстрированы реконфигурируемые мемристоры [14], которые реализовали переключение между диффузионным/летучим и дрейфовым/энергонезависимыми режимами при сохранении высокой производительности.

Устройства на основе тонких пленок перовскитных НК имеют более широкую запрещенную зону и более высокую стабильность, чем 3D-пленки галогенидных перовскитов из-за подавления миграции ионов Cs и галогенов. Эти свойства делают их подходящими для мемристорных приложений, требующих настраиваемых состояний проводимости, низкого энергопотребления и быстрого отклика. Недавно нами был предложен особый механизм резистивного переключения в мемристорах на



**Рис. 6.** ВАХ структуры ITO/PEDOT: PSS/CsPbI<sub>3</sub>/P3HT/ [60]PCBM/Cu, измеренные в темноте и при освещении, в полулогарифмическом (*a*) и двойном логарифмическом (*b*) масштабе.



Рис. 7. Зонные диаграммы структур ITO/PEDOT: PSS/CsPbBr<sub>3</sub>/P3HT/Cu (*a*) и ITO/PEDOT: PSS/CsPbI<sub>3</sub>/P3HT/[60]PCBM/Cu (*b*).

основе металлоорганических перовскитов, связанный с разбиением объема пленки на вихревые движения ионов и вакансий типа ячеек Бенара [15]. Было показано, что такие ячейки могут быть этапом подготовки объема галогенидных перовскитов к разбиению на множество близкорасположенных проволочек, образованных нейтральными вакансиями галогена и обеспечивающих электронную проводимость зазора, наряду с ионной. На наш взгляд указанный механизм также может проявляться в исследованных в этой работе структурах.

В то же время следует отметить, что структуры на основе НК галогенидных перовскитов также сталкиваются с определенными проблемами, такими как структурная сложность и наличие барьеров для переноса носителей. Поэтому необходимы дополнительные исследования для оптимизации их характеристик и преодоления ограничений для мемристорных приложений.

## 4. Заключение

В работе получены сандвич-структуры с использованием перовскитных НК CsPbBr<sub>3</sub>(I<sub>3</sub>), сопряженного полимера РЗНТ и производного фуллерена [60]РСВМ. Исследованы морфология и оптоэлектронные свойства полученных структур. Установлено, что при 300 К полученные структуры демонстрируют эффект памяти, заключающийся в переключении из высоко- в низкорезистивное состояние при подаче смещения и при освещении, при этом наблюдается изменение тока на 2 порядка для образцов, полученных с использованием [60]РСВМ и на 4 порядка для образцов без него. Природа наблюдаемого в таких структурах эффекта памяти связана с захватом носителей заряда ловушками. Исследованные материалы перспективны для использования в нейроморфных интерфейсах.

#### Благодарности

Авторы благодарны И.П. Щербакову и В.Н. Петрову за помощь в исследовании фотолюминесценции и АСМ соответственно, а также А.О. Белорусу — за помощь в синтезе НК неорганических перовскитов.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- Q. Li, T. Li, Y. Zhang, Y. Yu, Z. Chen, L. Jin, Y. Li, Y. Yang, H. Zhao, J. Li, J. Yao. Org. Electron. 77, 105461 (2020).
- [2] Z. Hao, H. Wang, S. Jiang, J. Qian, X. Xu, Y. Li, M. Pei, B. Zhang, J. Guo, H. Zhao, J. Chen, Y. Tong, J. Wang, X. Wang, Y. Shi, Y. Li. Adv. Sci. 9, 2103494 (2022).
- [3] T.Y. Wang, J.L. Meng, Z.Y. He, L. Chen, H. Zhu, Q.Q. Sun, S.J. Ding, P. Zhou, D.W. Zhang. Adv. Sci. 7, 1903480 (2020).
- [4] S. Liu, J. Zeng, Q. Chen, G. Liu. Front. Phys. **19**, 23501 (2024).
- [5] Y.N. Zhong, T. Wang, X. Gao, J.L. Xu, S.D. Wang. Adv. Funct. Mater. 28, 1800854 (2018).
- [6] N.A. Tulina, I.Y. Borisenko, V.V. Sirotkin. Phys. Lett. A 372, 6681 (2008).
- [7] Z. Ma, J. Ge, W. Chen, X. Cao, S. Diao, Z. Liu, S. Pan. ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 21207 (2022).
- [8] V. Mikheev, A. Chouprik, Y. Lebedinskii, S. Zarubin, A.M. Markeev, A.V. Zenkevich, D. Negrov, Nanotechnology 31, 215205 (2020).
- [9] Z. Shen, C. Zhao, Y. Qi, I.Z. Mitrovic, L. Yang, J. Wen, Y. Huang, P. Li, C. Zhao. Micromachines 11, 341 (2020).
- [10] A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, O.P. Chikalova-Luzina, L.B. Matyushkin, M.K. Ovezov, A.M. Ershova, I.N. Trapeznikova, V.N. Petrov. Synthetic Met. 260, 116291 (2020).
- [11] A.N. Aleshin. Nanobiotechnology Rep. 17, 873 (2022).
- [12] G.V. Nenashev, A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.N. Petrov. Solid State Commun. 348–349, 114768 (2022).
- [13] T.K. Su, W.K. Cheng, C.Y. Chen, W.C. Wang, Y.T. Chuang, G.H. Tan, H.C. Lin, C.H. Hou, C.M. Liu, Y.C. Chang, J.J. Shyue, K.C. Wu, H.W. Lin. ACS Nano 16, 12979 (2022).
- [14] R.A. John, Y. Demirag, Y. Shynkarenko, Y. Berezovska, N. Ohannessian, M. Payvand, P. Zeng, M.I. Bodnarchuk, F. Krumeich, G. Kara, I. Shorubalko, M.V. Nair, G.A. Cooke, T. Lippert, G. Indiveri, M.V. Kovalenko. Nature Commun. 13, 2074 (2022).
- [15] Н.И. Алексеев, А.Н. Алешин. ФТТ 66, 377 (2024).

Редактор К.В. Емцев